

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/796,081	LEE, YOUNG GIL	
Examiner	Art Unit	
Chuck Mah	3676	

SEARCH NOTES

SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
16	334					
	3037 306					
312	319.)				
	319.	2				
	323					
62	440					
220	259	259.2 , 259.3 , 263 264,				
·	315	263	,			
	326	264,				
	826					
	830-	832				
	843-	844x				

·	DATE	EXMR
•		
-		†
·		
		ļ
		
•		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
			- "		
			<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		•			